МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина электроника Лабораторный практикум №3

по теме: «Полупроводниковые диоды»

Работу выполнил: студентка группы ИУ7-34Б Ильченко Ева

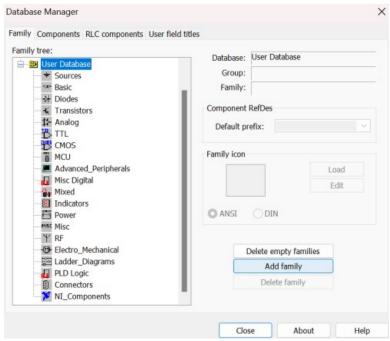
Работу проверил:

Цель работы

Получение и исследование статических и динамических характеристик германиевого и кремниевого полупроводниковых диодов с целью определение по ним параметров модели полупроводниковых диодов, размещения моделей в базе данных программ схемотехнического анализа. Приобретение навыковрасчета моделей полупроводниковых приборов в программах Multisim и Mathcad по данным, полученным в экспериментальных исследованиях, а также включение модели в базу компонентов.

ВКЛЮЧЕНИЕ МОДЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА,ЗАДАННОГО ОПИСАНИЕМ В ФОРМАТЕ PCPICE, В БАЗУ ДАННЫХ MULTISIM

Добавим пользовательский полупроводниковый диод D2C168A в базу данных программы Multisim.Сформируем новое семейство компонент в User Database.



Puc. 1 DatabaseManager.

Укажем имя нового семейства, где в будущем будут размещаться добавленные компоненты



Рис.2 Объявление имени нового семейства.

Указываем схемное обозначение элемента в окне Component RefDes–D (диод)

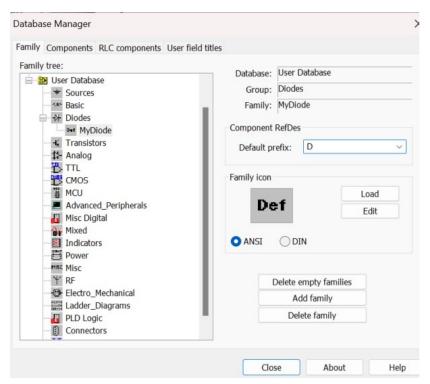


Рис.3 Схемное обозначение элемента.

Запускаем мастер создания компонента—Component Wizard, который «по шагам» поможет ввести компонент в созданную базу данных.С помощью помощника компонентов добавим диод D2C168A

На втором шаге вводим информация о том,сколько выводов имеет компонент и какое исполнение компонента.

Третий шаг по созданию компонента—это определение его графического представления на принципиальной схеме. Для одного компонента выберем условное изображение, копируя символ из базы данных Multisim.

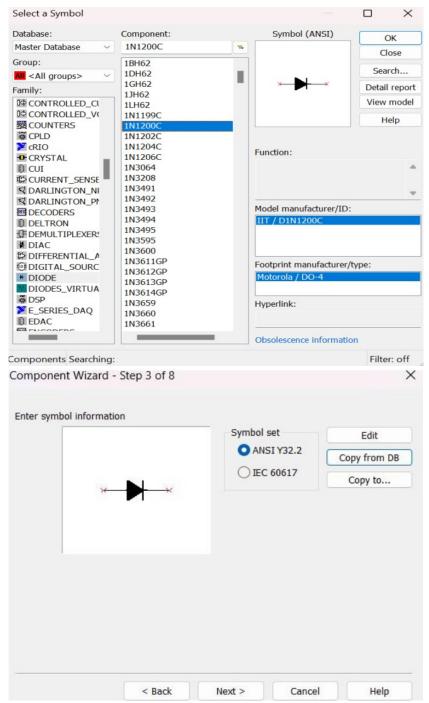


Рис.4-5 Шаг 3-добавление изображения диоду.

Четвёртый шаг—это определение параметров контактов компонента.

Pin table:		Add hidden	Add hidden pin Delete hidden pin	
Symbol pin name A	Section A	Type Bidirectional	ERC status Include	
К	Α	Bidirectional	Include	

Рис.6 Шаг 4–Пины диода.

Следующий шаг-пятый, предполагает введение данных об электрической модели компонента. На шестом шаге устанавливается связь между информационным символом и электрической моделью.

На седьмом шаге осуществляется внесение подготовленного компонента в базу Multisim.

Pin mapping table:	Symbol pins	Model nodes
	K	2
	A	1

Рис.7-8 Шаг 7-Распиновка диода.

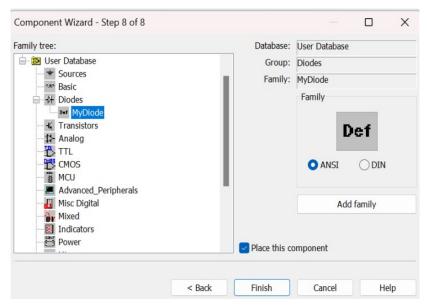


Рис.9 Шаг 8-Добавление диода в семейство.

В результате проведённых операций в User database появится новый элемент–полупроводниковый диод D2C168A. Мы включили диод в нашу базу данных и можем применять его в электрических схемах.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕТРОВ

В данном эксперименте я создам модельный стенд, используя заданный диод, и запишу результаты измерений тока и напряжения с помощью мультиметров.

Для начала, мы создадим простую электрическую цепь, включив в нее заданный диод:

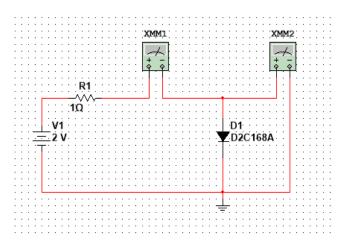


Рис.10.Схема для измерения ВАХ диода.

Установим мультиметр XMM1 в режим измерения тока (амперметра), а XMM2–в режим измерения напряжения (вольтметра), после чего начнем выполнение симуляции:

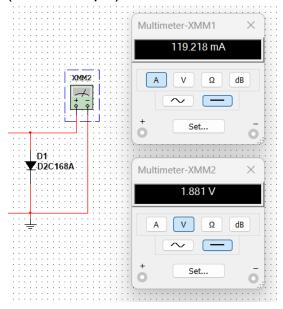


Рис.11.Запуск симуляции

Построим Вольт-Амперную Характеристику (BAX) диода,применив DC SWEEP((Simulate-> Analyses-> DC Sweep, Analyses parameters, Output).

Для этого, начнем с установки параметров для источника напряжения: установим начальное значение 0, конечное значение 2, и будем увеличивать напряжение с интервалом 0.05.

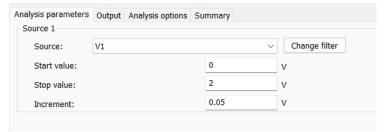


Рис.12.Параметры напряжения

Затем установим выходной параметр, который будет представлен в виде значения тока, проходящего через диод, и запустим симуляцию:

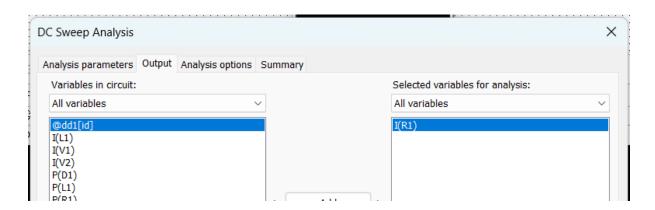


Рис.13. Установка выходных параметров.

В итоге мы получили вольт-амперную характеристику (ВАХ) диода для прямого тока.

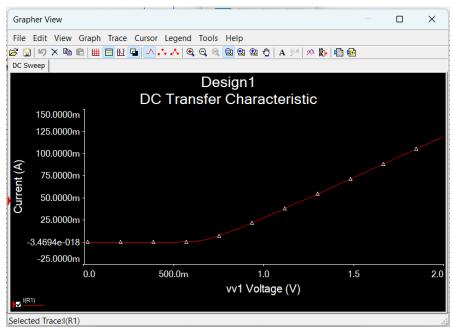


Рис.14.ВАХ диода по прямому току.

Пересоберём схему для обратного тока

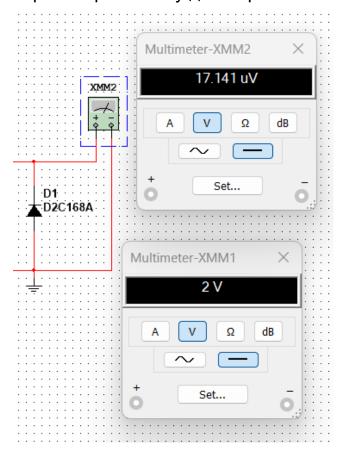


Рис. 15. Запуск симуляции

Для обратной цепи устанавливаем конечное напряжение от 0 до 10 и запускаем симуляцию:

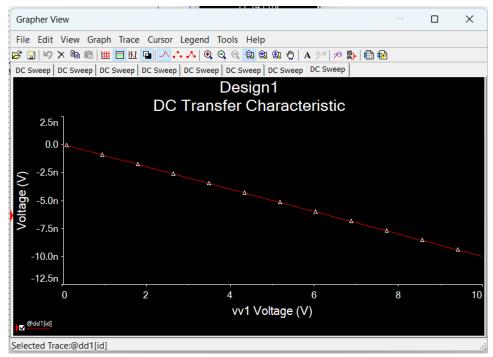


Рис.16.ВАХ диода по обратному току.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВАХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСЦИЛЛОГРАФА И ГЕНЕРАТОРА

В ходе третьего эксперимента, мы проведем измерение вольтамперной характеристики (BAX) диода с применением осциллографа, а затем воспользуемся Mathcad для вычисления его характеристических параметров.

Для начала создадим необходимую электрическую схему для измерения ВАХ с использованием осциллографа, где на входе В у нас установлен резистор с сопротивлением 1 Ом, и его напряжение численно равно току, проходящему через диод, а на входе А подается напряжение, измеренное на диоде.

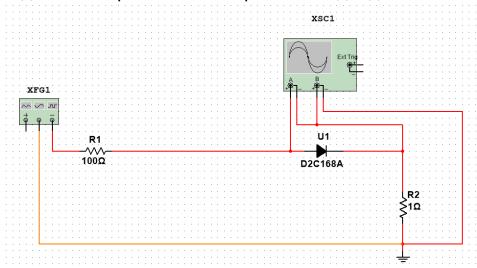


Рис.17.Схема для измерения ВАХ с осциллографом.

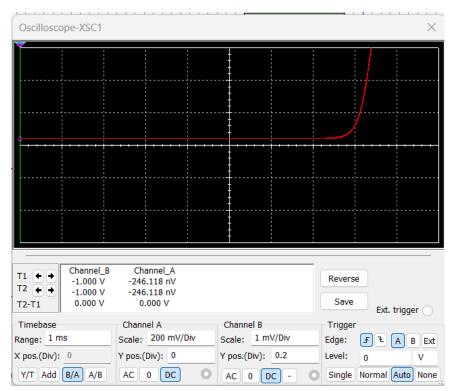
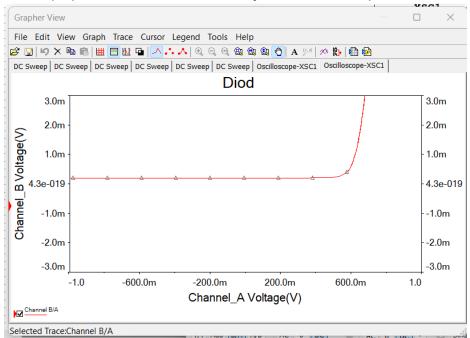


Рис.18.ВАХ диода на осциллографе.

Полученное BAX диода переносим в Grapher, а затем экспортируем ее в формат dlm для последующего импорта в Mathcad:



Puc.19.BAX диода в Grapher view.

В окне Grapher View формируем выходной текстовый файл с данными расчёта

Переносим данные в Mathcad и проведем расчет параметров диода, используя метод GivenMinerr:

		0	1
VAX =	0	-8.376·10 ⁻³	1.935 · 10 -8
	1	-3.376·10 ⁻³	1.355·10-7
	2	1.624.10-3	2.517·10-7
	3	6.624.10-3	3.679 • 10-7
	4	0.012	4.841 · 10-7
	5	0.017	6.003 · 10 - 7
	6	0.022	7.164 · 10-7
	7	0.027	8.326 10-7
	8	0.032	9.488 · 10-7
	9	0.037	1.065.10-6
	10	0.042	1.181.10-6
	11	0.047	1.221 · 10-6
	12	0.052	1.227 · 10-6
	13	0.057	1.233·10-6
	14	0.062	1.239·10-6
	15	0.067	

Рис.20.Данные в Mathcad.

Puc. 20. Equipment 8 invaridad.

$$Ud1 := (VAX^{(0)})_{107} = 0.502 \qquad Ud2 := (VAX^{(0)})_{120} = 0.567 \qquad Ud3 := (VAX^{(0)})_{135} = 0.642$$

$$Id1 := (VAX^{(1)})_{107} = 2.909 \times 10^{-5} \qquad Id2 := (VAX^{(1)})_{120} = 1.575 \times 10^{-4}$$

$$Rb := 1 \qquad Is0 := 0.0000001 \qquad m_o := 2 \qquad Ft := 0.02$$

$$Given \qquad Ud4 := (VAX^{(0)})_{135} = 1.303 \times 10^{-3}$$

$$Ud4 := Id1 \cdot Rb + In \left(\frac{Is0 + Id1}{Is0} \right) \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud2 = Id2 \cdot Rb + In \left(\frac{Is0 + Id1}{Is0} \right) \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud3 = Id3 \cdot Rb + In \left(\frac{Is0 + Id3}{Is0} \right) \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud4 = Id4 \cdot Rb + In \left(\frac{Is0 + Id4}{Is0} \right) \cdot m \cdot Ft$$

$$Ud4 = Id4 \cdot Rb + In \left(\frac{Is0 + Id4}{Is0} \right) \cdot m \cdot Ft$$

$$Diod_P := Minerr(Is0, Rb, m, Ft)$$

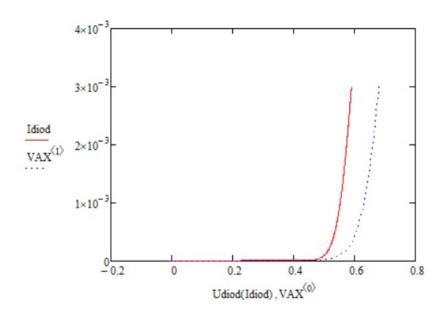
$$Diod_P = \begin{pmatrix} 3.386 \times 10^{-11} \\ 7.714 \times 10^0 \\ 1.873 \times 10^0 \\ 1.961 \times 10^{-2} \end{pmatrix}$$

Рис.21.Расчет параметров диода.

Строим графики по данным из Multisim и по полученным с помощью Given-Minerr данным:

$$Idiod := 0, 10^{-5} ... 3 \cdot 10^{-3}$$

$$Udiod(Idiod) := Idiod \cdot Rb + Ft \cdot ln \left(\frac{Idiod + Is0}{Is0} \right)$$



Puc.22.Обработка полученной BAX в программе Mathcad

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ДИОДА ПРИ ПОМОЩИ ОСЦИЛЛОГРАФА.

В эксперименте мы собираемся исследовать, как диод выпрямляет сигнал. Сначала нам нужно настроить осциллограф, чтобы измерить временную развертку сигнала, используя гармонический сигнал.

Настроим осциллограф на измерение временной развертки сигнала генератора(клавиша Y/T): частота генератора 1 кГц, амплитуда 10В.

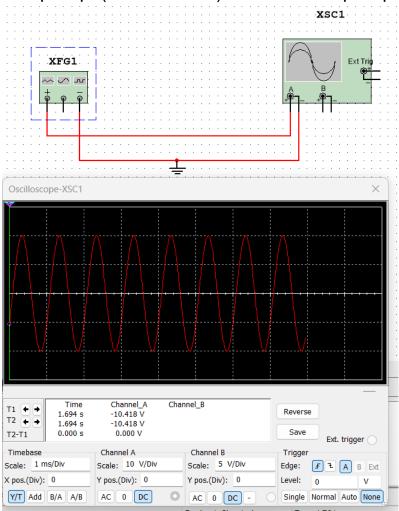


Рис.23.Настройка осциллографа.

Теперь добавим в схему диод и сопротивления.

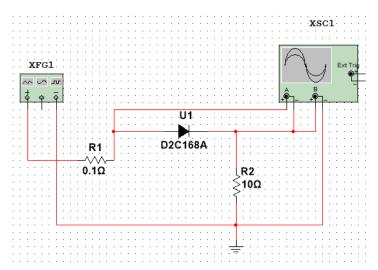


Рис.24.Схема с диодом.

На канале А мы анализируем напряжение, измеренное на диоде, а на канале Б фиксируем напряжение на нагрузочном резисторе:

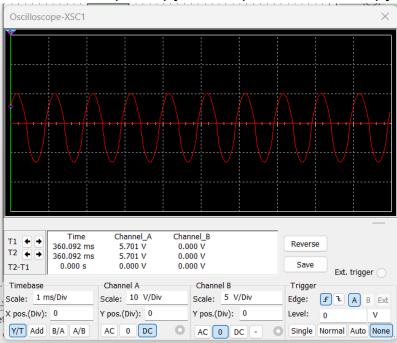


Рис.25.Напряжение на диоде.

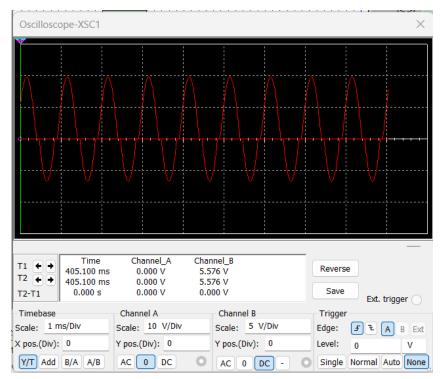


Рис. 26. Напряжение на нагрузочном резисторе.

Если параллельно нагрузочному резистору поставить накопительный конденсатор, среднее напряжение вырастет, как и полагается, в корень из 2 раз.

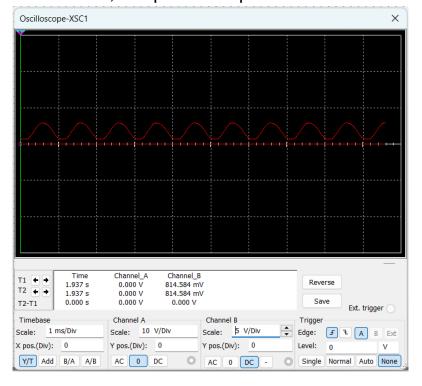


Рис.27. Напряжение на нагрузке с конденсатором.

Вывод

Целью данного исследования было получение и анализ статических и динамических характеристик германиевых и кремниевых полупроводниковых диодов с целью определения параметров модели полупроводниковых диодов и их последующего включения в базу данных программ для схемотехнического анализа. Я приобрела навыки расчета моделей полупроводниковых приборов с использованием программных средств, таких как Multisim и Mathcad, на основе данных, полученных в ходе экспериментальных исследований. Это позволило внедрить полученные модели в базу компонентов для будущих проектов и анализа полупроводниковых приборов.